



# Universidad Tecnológica de la Mixteca

Clave DGP: 557524

## Maestría en Ciencias de Materiales

### PROGRAMA DE ESTUDIOS

#### NOMBRE DE LA ASIGNATURA

**Técnicas de Caracterización de Materiales**

SEMESTRE	CLAVE DE LA ASIGNATURA	TOTAL DE HORAS
<b>Tercero</b>	<b>300301</b>	<b>85</b>

#### OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA

Conocer y asimilar los conceptos fundamentales de técnicas para el estudio y caracterización de materiales.

#### TEMAS Y SUBTEMAS

##### **1. Microscopias**

- 1.1. Microscopia óptica
- 1.2. Microscopia de barrido con electrones (SEM)
- 1.3. Microscopia de transmisión de electrones (TEM)
- 1.4. Microscopia de fuerza atómica (AFM)
- 1.5. Microscopia por efecto túnel (STM)

##### **2. Técnicas de estudios espectrales**

- 2.1. Espectroscopia por dispersión de energía de rayos X (EDS)
- 2.2. Espectroscopia por dispersión de longitud de onda (WDS)
- 2.3. Espectroscopia por pérdida de energía de electrones (EELS)

##### **3. Caracterización óptica**

- 3.1. Espectroscopia UV-Vis
- 3.2. Luminiscencia
- 3.3. Fotorreflectancia
- 3.4. Elipsometria

##### **4. Caracterización estructural por difracción y dispersión**

- 4.1. Difracción de rayos X (XRD)
- 4.2. Difracción de electrones de baja energía (LEED)

- 4.3. Dispersión a ángulo pequeño (SAXS)
- 4.4. Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS)
- 4.5. Espectroscopia electrónica Auger (AES)

## **5. Espectroscopias vibracionales y resonantes**

- 5.1. Espectroscopia Raman
- 5.2. Espectroscopia Infrarroja con transformada de Fourier (FTIR)
- 5.3. Resonancia magnética nuclear (NMR)
- 5.4. Resonancia Paramagnética Electrónica (EPR)

### **ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**

Las sesiones serán Teórico-Prácticas, dirigidas por el profesor y desarrolladas mediante el uso de los medios de apoyo didáctico, a través de computadora y medios digitales, para las sesiones prácticas, se planea realizarlas utilizando equipos de DRX, SEM-EDS, TEM, UV-VIS y NMR.

### **CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN**

La evaluación del curso comprenderá tres calificaciones parciales que tendrán una equivalencia del 50% y una calificación final que corresponderá al 50% restante. Para cada calificación parcial se deberá considerar un examen escrito, tareas y prácticas de laboratorio. La calificación final deberá incluir un examen escrito y un proyecto final de aplicación o de investigación, con temas estrictamente afines a la materia. Los porcentajes correspondientes, en los aspectos considerados para las calificaciones parciales y la final, se definirán el primer días de clases, con la participación de los alumnos.

### **BIBLIOGRAFÍA (TIPO, TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL Y AÑO)**

#### **Básica:**

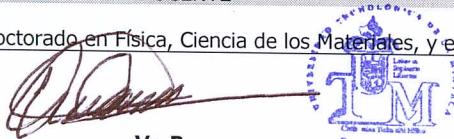
1. The basics of crystallography and diffraction, C. Hammond, Oxford University Press Inc., New York, (2009).
2. Powder diffraction: Theory and practice, R.E. Dinnebier and S.J.L. Billinge, Royal Society of Chemistry, (2008).
3. Elements of X-Ray diffraction, B.D. Cullity and S. R. Stock, Pearson (2001).
4. Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis. A text for Biologists, Materials Scientists and Geologists, Second Edition, Joseph I. Goldstein; (1994).
5. Transmission electron microscopy: a textbook for materials science, D. B. Williams, Plenum Pres., (1996).
6. Encyclopedia of materials characterization: Surfaces, interfaces, thin Films. Ed. C. R. Brundle, C. A. Evans, S. Wilson, Butterworth-Heinemann, Boston, (1992).

#### **Consulta:**

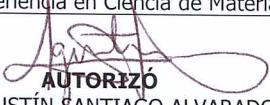
1. Fundamentals of powder diffraction and structural characterization of materials, V.K. Pecharsky and P.Z. Zavalij, Springer, (2008).
2. Methods in X-Ray crystallography. J.W. Jeffery, Academic Press, Londres, (1971).
3. Microstructural characterization of materials. D. Brandon y W. Kaplan. John Wiley and Sons, Nueva York, N.Y., (1999).
4. Light and electron microscopy. E. M. Slayter y H. S. Slayter. Cambridge University Press, Cambridge, (1992).
5. Microscopy techniques for materials science, A.R. Clarke, CRC Pres., (2002).

### **PERFIL PROFESIONAL DEL DOCENTE**

Maestría o Doctorado en Física, Ciencia de los Materiales, y en áreas afines con experiencia en Ciencia de Materiales.



**Vo.Bo**  
DR. JOSÉ ANÍBAL ARIAS AGUILAR  
JEFE DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

  
**AUTORIZÓ**  
DR. AGUSTÍN SANTIAGO ALVARADO  
VICE-RECTOR ACADÉMICO